

Feinstrukturuntersuchungen in der Werkstoffkunde

Vorwort	5
1. KRISTALLOGRAPHISCHE GRUNDLAGEN	9
1.1 Kristallsysteme, Raumgitter und Punktlagen	9
1.2 Kristallklassen und Raumgruppen	12
1.3 Beschreibung von Ebenen und Richtungen im Kristall ..	13
1.4 Darstellung von Kristallorientierungen in der stereographischen Projektion	17
2. BEUGUNG VON WELLEN AN PUNKTGITTERN	22
2.1 Die Reflexionsbedingung	23
2.2 Abweichungen von der Braggschen Gleichung	24
2.3 Reflexionsbedingung im reziproken Gitter	28
2.4 Zur Gestalt der reziproken Gitterpunkte	30
2.5 Intensität von Reflexen	33
2.6 Monochromatorkristall und Fokussierungsbedingungen ..	39
2.7 Die Kohärenzlänge	40
3. ALLGEMEINES ÜBER RÖNTGENUNTERSUCHUNGEN ..	42
3.1 Erzeugung von Röntgenstrahlen	42
3.2 Absorption von Röntgenstrahlen	45
3.3 Nachweis von Röntgenstrahlen	47
3.4 Grobstrukturuntersuchungen	49
3.5 Blenden	52
4. FEINSTRUKTURUNTERSUCHUNGEN MIT RÖNTGENSTRÄHLEN	53
4.1 Debye-Scherrer-Methode	54
4.1.1 Debye-Scherrer-Aufnahmen mit der Zylinderkamera	58
4.1.2 Breite von Debye-Scherrer-Linien	62
4.1.3 Rückstrahllaufnahmen	65
4.1.4 Röntgenographische Spannungsmessung	70
4.1.5 Texturmessungen	73

4.2 Laue-Aufnahmen	80
4.2.1 Orientierungsbestimmungen an Einkristallen	82
4.2.2 Darstellung einer Laue-Aufnahme im reziproken Gitter	85
4.2.3 Gestalt eines Laue-Fleckes	86
4.3 Drehkristallverfahren	88
4.3.1 Orientierungsbestimmung für Einkristalle	88
4.3.2 Strukturbestimmungen	91
4.4 Kleinwinkelstreuung	93
5. ELEKTRONENOPTISCHE VERFAHREN	95
5.1 Transmissionsmikroskopie	95
5.1.1 Lichtmikroskop	95
5.1.2 Das Durchstrahl-Elektronenmikroskop	97
5.1.3 Zur Probenherstellung	99
5.1.4 Beugung von Elektronenstrahlen	100
5.1.5 Beugungskontraste	104
5.2 Rastermikroskopie	107
5.2.1 Lichtrastermikroskop	108
5.2.2 Elektronenrastermikroskop	109
5.2.3 Röntgenspektroskopie	110
5.2.4 Mikrosonde	111
5.3 Emissionsmikroskopie	115
5.3.1 Feldelektronenmikroskop	116
5.3.2 Feldionenmikroskop	117
5.3.3 Photoemissions-Elektronenmikroskop	118
6. NEUTRONENBEUGUNG	119
ÜBUNGSAUFGABEN	125
LÖSUNGEN ZU DEN ÜBUNGSAUFGABEN	129
REGISTER	135
